

عنوان مقاله:

اندازه گیری ضخامت چند لایه های اپتیکی نازک به کمک چیدمان میکروسکوپ هم کانونی نور سفید

محل انتشار:

سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

ابراهیم بحرودی - تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

علی موسویان - تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

حمید لطیفی - تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما

خلاصه مقاله:

میکروسکوپ هم کانونی نور سفید در زیرشاخه میکروسکوپ های اپتیکی و غیرمخرب قرار میگیرد از این میکروسکوپ می توان در تجسم نگاری سهبعدی از سطوح استفاده کرد در این مقاله به کاربرد این میکروسکوپ در اندازه گیری ضخامت لایه های نازک اپتیکی اشاره کرد بدین صورت که ابتدا چیدمان میکروسکوپ را توسط نرم افزار طراحی اپتیکی Zemax شبیه سازی کرده و سپس چیدمان آزمایشگاهی آن تشکیل می شود در نهایت هم در شبیه سازی و هم در آزمایش ضخامت یک نمونه لایه اپتیکی در ابعاد میکرون اندازه گرفته می شود.

کلمات کلیدی:

میکروسکوپ همکانونی نور سفید، ضخامت سنجی، شبیه سازی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/105692>

